

# Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w systemach zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 i ISO 17025:2018

Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin szkoleniowych

Opis:

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami terminologii metrologicznej. W trakcie zostaną omówione wymagania norm i standardów (ISO 9001:2015, IATF 16949:2015 i ISO 17025:2018) w zakresie nadzoru nad wyposażeniem. Uczestnicy dowiedzą się jakie są wymagania odnośnie prowadzenia analizy statystycznej systemów pomiarowych oraz jak określać zgodności i niezgodności ze specyfikacją z uwzględnieniem niepewności pomiaru.

Program:

- Podstawy terminologii metrologicznej. Wybrane elementy metrologii prawnej. Działalność GUM i PCA oraz ich odpowiedników za granicą.
- Wymogi ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 i ISO 17025:2018 w zakresie nadzoru nad wyposażeniem.
- Wymogi IATF 16949:2016 w zakresie analizy statystycznej systemów pomiarowych.
- Reguły orzekania zgodności i niezgodności ze specyfikacją.

Dodatkowe informacje:

Dbamy o to, żeby dużą część szkolenia zajęły ćwiczenia i praktyczne warsztaty – wtedy uczestnikom szkolenia łatwiej zapamiętać nowe dla nich informacje.

---

Szczegółowy zakres szkolenia zostanie uzgodniony po dalszej analizie potrzeb szkoleniowych.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

#### Adresaci:

Pracownicy działów jakości odpowiedzialni za organizację i nadzorowanie systemów pomiarowych. Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością.  
Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości i budowanie planów kontroli oraz weryfikowanie skuteczności prowadzonych kontroli.